

Lundi 8	Mardi 9 juin		Mercredi 10 juin		Jeudi 11 juin		Vendredi 12 juin
	8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		9:00 – 11:00
	8:30 – 9:00 <i>Ouverture et présentation de l'atelier</i>		Session 2 <i>Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance</i>		MA 1 <i>Contrôle non destructif</i>		Tutoriel 7 <i>Tests électriques pour l'analyse de défaillance</i>
	9:00- 10:00 <i>Keynote</i>				Tutoriel 5 <i>Technologie et analyse de défaillance des relais</i>		MA 5 <i>Packaging, PCB et assemblages</i>
							MA 7 <i>Contrefaçon ou défaut de fabrication ?</i>
11h	10:15 – 12:15		10:30 – 12:00		10:30 – 12:00		
Ouverture de l'accueil	Tutoriel 3 <i>Techniques électroniques pour la localisation de défauts</i>	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	Session 2 <i>Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance</i>	MA 2 <i>Connectique</i>	Session 5 <i>Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation</i>	MA 5 <i>Packaging, PCB et assemblages</i>	11:15– 11:45
							<i>Bilan de l'atelier</i>
12h00/14h00 Déjeuner	Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner
14h00-16h00	14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00
Tutoriel 1 <i>Techniques d'analyses non destructives : X ray Tomographie X</i>	Tutoriel 4 <i>Analyse de surface</i>	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	MA 3 <i>Fonctionnement d'un labo d'analyse: les pièges à éviter</i>	Session « <i>Analyse de défaillance des composants passifs</i>	Tutoriel 6 <i>Procédés d'assemblage</i>	Session 5 <i>Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation</i>	Départ
							<div style="background-color: #000080; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <p>ATELIER 2026 20^{ème} atelier ANADEF</p> </div>
16:30 – 18:00	16:30 – 18:00		16:30 – 18:00		16:30 – 18:00		
Tutoriel 2 <i>Microscopie électronique / ionique FIB</i>	<i>Open questions</i>	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	Session 4 <i>Analyse de défaillance des circuits intégrés VLSI</i>	MA 4 <i>Impact normes et législations sur l'analyse de défaillance</i>	<i>Open questions</i>	MA 6 <i>Nouveaux composants, nouveaux défis.</i>	
			Soirée VLSI		Soirée anniversaire		